

DIN EN 1071-1:2003-06 (D)

Hochleistungskeramik - Verfahren zur Prüfung keramischer Schichten - Teil 1:
Bestimmung der Schichtdicke mit einem Kontaktprofilometer; Deutsche Fassung EN
1071-1:2003

| Inhalt | Seite |
|--|--------------|
| Vorwort | 2 |
| 1 Anwendungsbereich | 3 |
| 2 Normative Verweisungen | 3 |
| 3 Grundlagen des Verfahrens | 3 |
| 4 Geräte | 3 |
| 5 Probenahme und Vorbereitung der Proben | 4 |
| 6 Durchführung | 4 |
| 7 Grenzen für die Stufenhöhe | 5 |
| 8 Wiederholpräzision | 5 |
| 9 Prüfbericht | 5 |
| Anhang A (informativ) Einfluss des Verstärkungsfaktors und der Nivellierungsabweichung auf die gemessene Schichtdicke | 8 |